

機器利用技術講習会のご案内

【球面収差補正機能付走査透過電子顕微鏡 (Cs-STEM)】

地方独立行政法人大阪産業技術研究所和泉センターでは、所有している試験研究機器等を用いて、中小企業の皆様の新技術・新製品の開発や生産管理・品質管理をお手伝いさせて頂いております。これら試験研究機器の利用可能範囲や仕様・性能などの特徴を、より具体的にご理解いただき、皆様方に一層ご利用いただくため、下記の要領で講習会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。

- ◆日 時： ① 平成29年10月 4日 (水) 9:45～11:45
 ② 平成29年10月11日 (水) 9:45～11:45
 ③ 平成29年10月11日 (水) 13:15～15:15
 ④ 平成29年10月12日 (木) 9:45～11:45

※①～④とも同じ内容の講習を行います。ご希望の日をお選び下さい。

(バスでお越しの場合、①、②、④は9:27に、③は12:54に和泉中央駅を出発するバスで間に合います。)

○当研究所内に食堂がございます。一般の方もご利用になれます。(営業時間：11:45～13:15)

◆場 所：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター (和泉市あゆみ野2-7-1)

当日は、講習開始時刻までに当研究所の玄関ホール 講習会受付にて、受付をお済ませください。担当者が講習会場にご案内します。(受付は講習会開始時間の10分前より始めます。)

◆定 員：各コース(①～④)とも1社のみ。参加人数は1社3名まで

※ 受講票は発行いたしません。返信で受付をお知らせします。

※ 受講には顧客登録カード(Kカード)が必要です。まだお持ちでない方は、申込み方法をご連絡いたします。

◆費 用：無料

◆申込み先：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 顧客サービス部

※ お申込みは、メール (fukyu@tri-osaka.jp) またはFAX (0725-51-2520) でお願ひします。

※ 当研究所の催事情報等をお知らせする「ORIST EXPRESS 和泉センター版(メールニュース)」の配信をご希望のかたは、申込書にメールアドレスをご記入ください。

◆対象機器：球面収差補正機能付走査透過電子顕微鏡

球面収差補正装置(Csコレクタ)を搭載した走査透過電子顕微鏡(STEM)と、エネルギー分散型特性X線分析装置(EDS)ならび電子線エネルギー損失分光装置(EELS)から構成され、従来困難とされていた原子分解能観察や界面などの微小領域分析(数十～数nm)を行うことができる機器です。3種類の像(明視野像、HAADF像、二次電子像)観察、EDSやEELSを用いたB～Uまでの元素分析(点、線、面分析)、軽元素(Li、N等)のマッピング、EELSスペクトルの取得などが可能で、形状や膜厚、結晶構造、組成、化学結合状態を知ることができます。



走査透過電子顕微鏡(日立 HD-2700)

本機器を用いることで、ナノ粒子や触媒、そして電池をはじめとした新工ネ関連材料に対し、他の評価装置では得られない「ナノ領域」についての有益な情報が数多く得られ、材料・デバイスの高性能化や高度な製品評価技術の確立にお役立ていただいております。

本講習会では、機器の概要説明と解析事例の紹介をした後、当所が用意した試料を用い観察や分析の実演を行います。

◆持ち込み試料について：講習会中に観察してみたい試料がある場合は、事前にご相談ください。

◆講習担当：

(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 応用材料化学研究部 (長谷川泰則・尾崎友厚)

・お問い合わせ先：顧客サービス部 (TEL：0725-51-2518)

